

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 3 区分
 【発行日】平成 25 年 6 月 27 日 (2013.6.27)

【公開番号】特開 2012-70319 (P2012-70319A)
 【公開日】平成 24 年 4 月 5 日 (2012.4.5)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-014
 【出願番号】特願 2010-215144 (P2010-215144)
 【国際特許分類】

H 0 4 N 5/367 (2011.01)

H 0 1 L 27/14 (2006.01)

【F I】

H 0 4 N 5/335 6 7 0

H 0 1 L 27/14 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 25 年 5 月 15 日 (2013.5.15)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 8
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 8】

この発明に係る画像処理方法は、欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、欠陥画素検出対象画素の信号値との差分絶対値に対して、第一のしきい値と第一のしきい値より大きい第二のしきい値とによって欠陥画素検出対象画素が欠陥画素であるか否かを判定する欠陥画素判定ステップと、差分絶対値が、第一のしきい値より大きく第二のしきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定し、差分絶対値が第二のしきい値より大きい場合は動的補正方法により補正処理を行うと判定する登録画素判定ステップとを備えたものである。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 9】

この発明の画像処理方法は、不明瞭な欠陥画素を静的補正の対象と判定し、明瞭な欠陥画素を動的補正の対象と判定するようにしたので、静的補正用の欠陥画素アドレスメモリを省メモリ化でき、かつ、動的補正における欠陥画素の補正漏れや欠陥画素補正に起因する解像度低下を防止することができる。

【手続補正 3】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出対象画素の信号値との差分絶対値に対して、第一のしきい値と当該第一のしきい値より大きい第二のしきい値とによって前記欠陥画素検出対象画素が欠陥画素であるか否かを判定

する欠陥画素判定ステップと、

前記差分絶対値が、前記第一のしきい値より大きく前記第二のしきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定し、前記差分絶対値が前記第二のしきい値より大きい場合は動的補正方法により補正処理を行うと判定する登録画素判定ステップとを備えた画像処理方法。

【請求項 2】

欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出対象画素の信号値との差分絶対値が、所定のしきい値を超える場合は、前記欠陥画素検出対象画素が欠陥画素であると判定する欠陥画素判定ステップと、

前記欠陥画素が、独立した画素として存在する単キズであるか、連続した画素として存在する連キズであるかを判定する連キズ判定ステップと、

前記連キズ判定ステップでの判定結果が連キズであった場合は、静的補正方法により補正処理を行うと判定する登録画素判定ステップとを備えた画像処理方法。

【請求項 3】

欠陥画素判定ステップでは、第一のしきい値と、当該第一のしきい値より大きい第二のしきい値とを設け、これら第一及び第二のしきい値との比較により判定を行い、

登録画素判定ステップでは、単キズの差分絶対値が前記第一のしきい値より大きく前記第二のしきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定することを特徴とする請求項 2 記載の画像処理方法。

【請求項 4】

欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出対象画素の信号値との差分絶対値に対して、第一のしきい値と当該第一のしきい値より大きい第二のしきい値とによって前記欠陥画素検出対象画素が欠陥画素であるか否かを判定する欠陥画素検出部と、

前記差分絶対値が、前記第一のしきい値より大きく前記第二のしきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定し、前記差分絶対値が前記第二のしきい値より大きい場合は動的補正方法により補正処理を行うと判定する登録画素判定部とを備えた画像処理装置。

【請求項 5】

欠陥画素検出対象画素を含む所定サイズのブロックの平均信号値と、前記欠陥画素検出対象画素の信号値との差分絶対値が、所定のしきい値を超える場合は、前記欠陥画素検出対象画素が欠陥画素であると判定する欠陥画素検出部と、

前記欠陥画素が、独立した画素として存在する単キズであるか、連続した画素として存在する連キズであるかを判定し、当該判定結果が連キズであった場合は、静的補正方法により補正処理を行うと判定する登録画素判定部とを備えた画像処理装置。

【請求項 6】

欠陥画素検出部では、第一のしきい値と、当該第一のしきい値より大きい第二のしきい値とを設け、これら第一及び第二のしきい値との比較により判定を行い、

登録画素判定部では、単キズの差分絶対値が前記第一のしきい値より大きく前記第二のしきい値より小さい場合は静的補正方法により補正処理を行うと判定することを特徴とする請求項 5 記載の画像処理装置。

【請求項 7】

請求項 1 から請求項 3 のうちのいずれか 1 項記載の画像処理方法をコンピュータに実行させるための画像処理プログラム。